



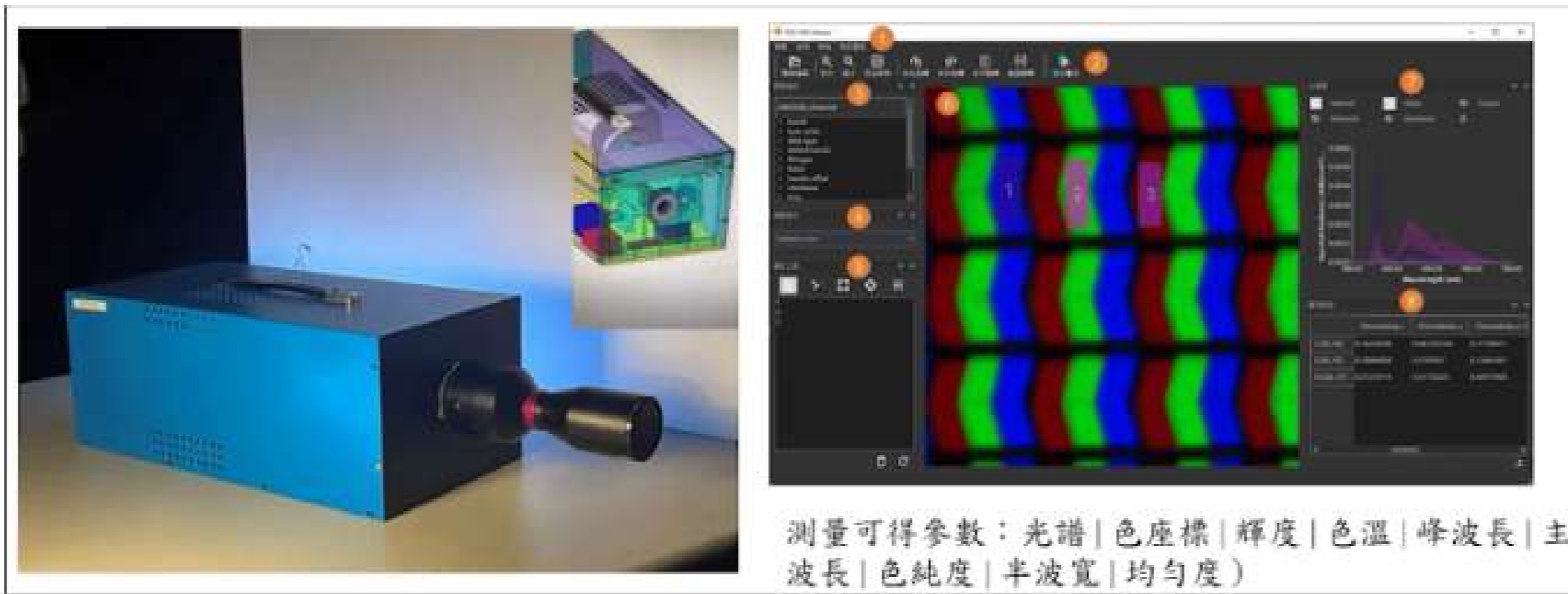
2023 Taiwan AOI Forum & Show 第二十三屆全國AOI論壇與展覽

新竹市大專路1001號 陽明交迴大學電子資訊大樓

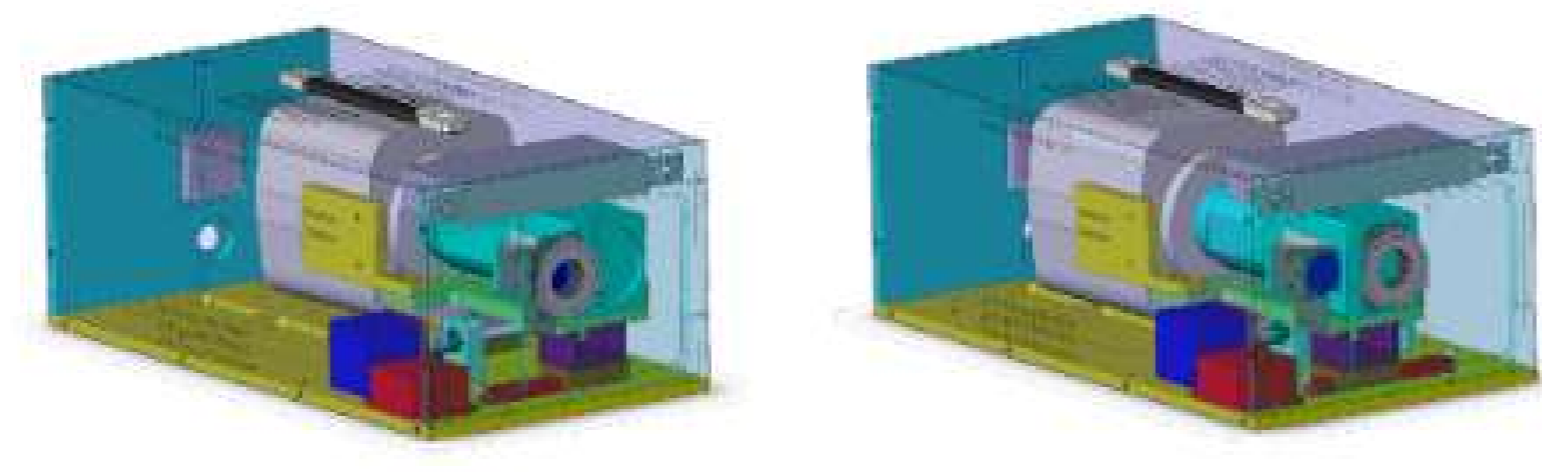
具備 AI 能力的自動光學檢查(AOI)透過演算法，不僅提升光學檢測的品質與速度並改良傳統以人力使用光學儀器進行檢測的缺點。【Taiwan AOI Forum & Show】即將在 9/28(四) 展出 五鈴光學 參展攤位：展16 誠邀邀請您蒞臨參觀指教！

五鈴光學【AOI展】展出產品搶先看

Mini / Micro LED量測 - 『SBIR』 微型LED顯示模組之高光譜影像分析儀
LED顯示面板技術正式邁入微型化 Micro LED 時代，然面對LED晶粒尺寸大幅縮小，晶粒數量級的大幅提升，也大大提升顯示模組的光學色度檢測在檢測速度及精度的難度與挑戰。五鈴光學開發的 2D Spectra-Radiometer-高光譜影像分光輻射儀，是採線推式高光譜分光方式量測，取到 2000x2000 pixels 的光譜輻射量度值後，再乘上CIE 1931 XYZ等色函數，以達二維面型高精度分光輻射輝度及色度測量的目的。
※此系統特色改善一般線推式高光譜儀使用上不容易對實際待測物對焦的缺點。



測量可得參數：光譜|色座標|輝度|色溫|峰波長|主波長|色純度|半波寬|均勻度)



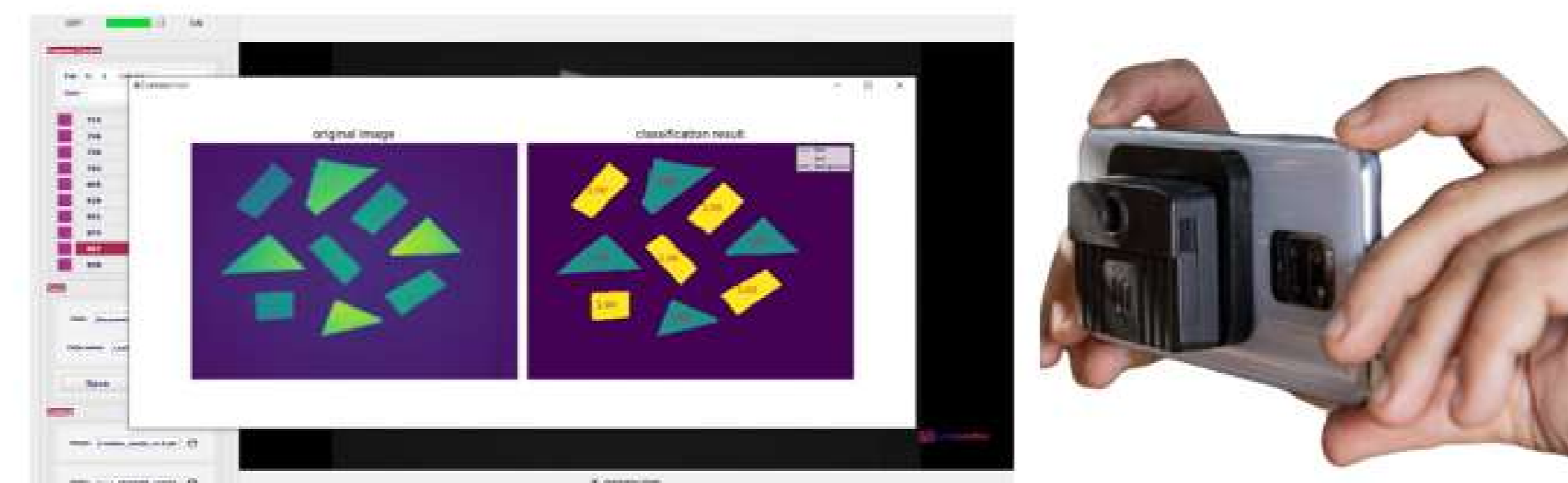
VIS 實時多光譜(彩色)相機畫中對焦 (左)

V8E 高光譜相機-內置掃描模式(右)

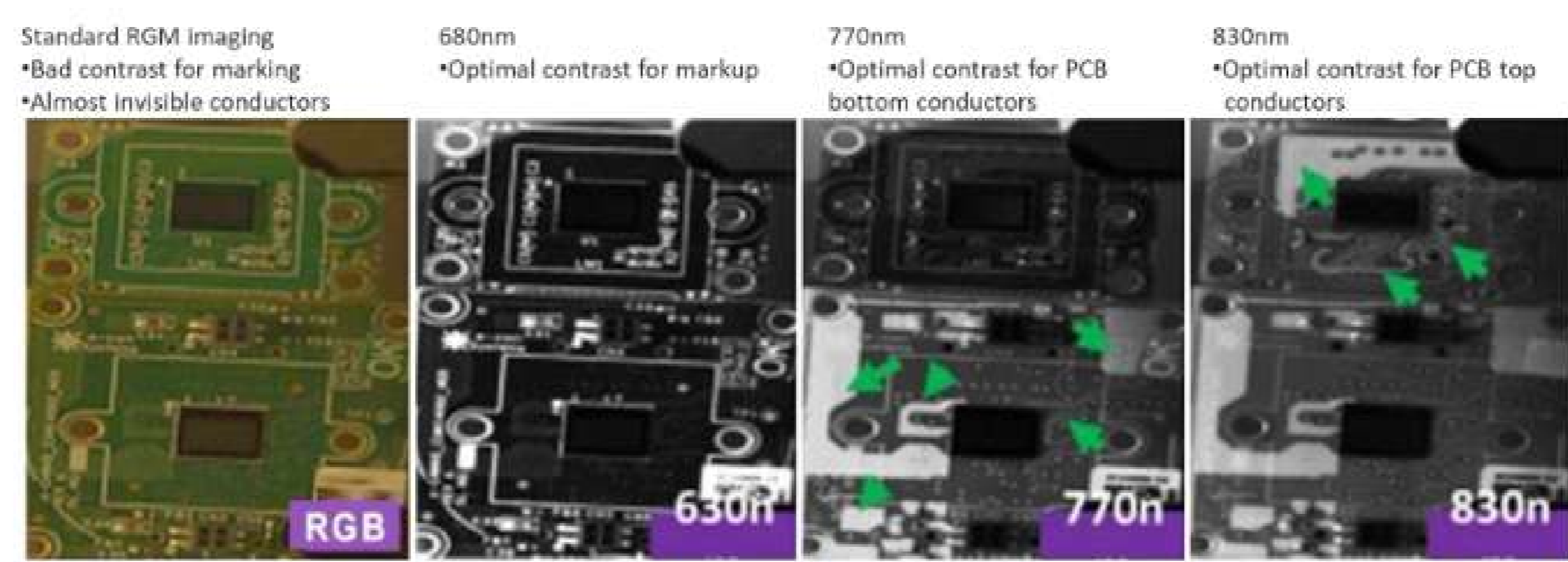
- 光譜解析度FWHM~3nm
- 高速演算，4百萬筆光譜輝度色度資料計算可在2sec內完成及顯示。同時兼具內置掃描及外部移動台掃描雙功能模式。

電路板量測 - Unispectral Monarch II 手機多光譜

來自以色列新開發的低成本近紅外多光譜相機，可透過特殊分光薄片取得10個近紅外波段的多光譜影像，並進行計算及材料分類，相機輕巧且價格較於傳統光譜相機更加低廉，同時可與手機裝置進行連接。



抑或是在複雜材料上，例如電路板量測，透過切換各單波段找到最具對比度的影像並進行後續影像分析找出缺陷及標記位置。



Standard RGB imaging
•Bad contrast for marking
•Almost invisible conductors

680nm
•Optimal contrast for marking

770nm
•Optimal contrast for PCB bottom conductors

830nm
•Optimal contrast for PCB top conductors

了解更多

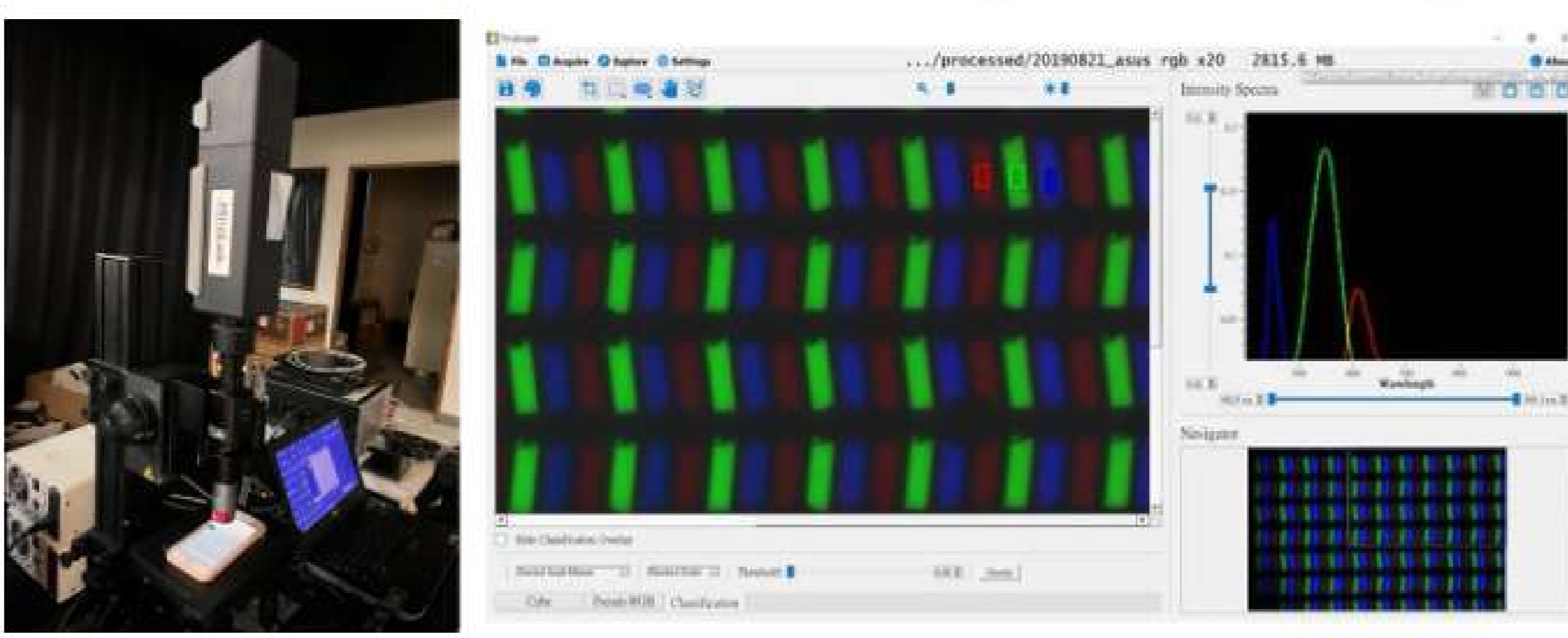
LED面板量測 - Hinalea 4250

LED面板光譜量測，透過x20工業顯微鏡放大檢視並量測手機面板上每一顆LED的主波長、峰波長、半波寬等訊號，可應用於LED面板檢測相關開發。

系統型號規格	
顯微鏡	Mitutoyo-VMU
物鏡	Mitutoyo-x20 NIR apo
相機 (波長掃描式)	<ul style="list-style-type: none"> Hinalea-4250影像解析度: 2.3MP 波段範圍: 400-1000nm 光學解析度: 4nm(FWHM)

利用 Hinalea-4250 透過最高300個波段完整獲取高光譜影像，進行顯示器面板檢測，並獲取各個LED的完整光譜特性。

了解更多

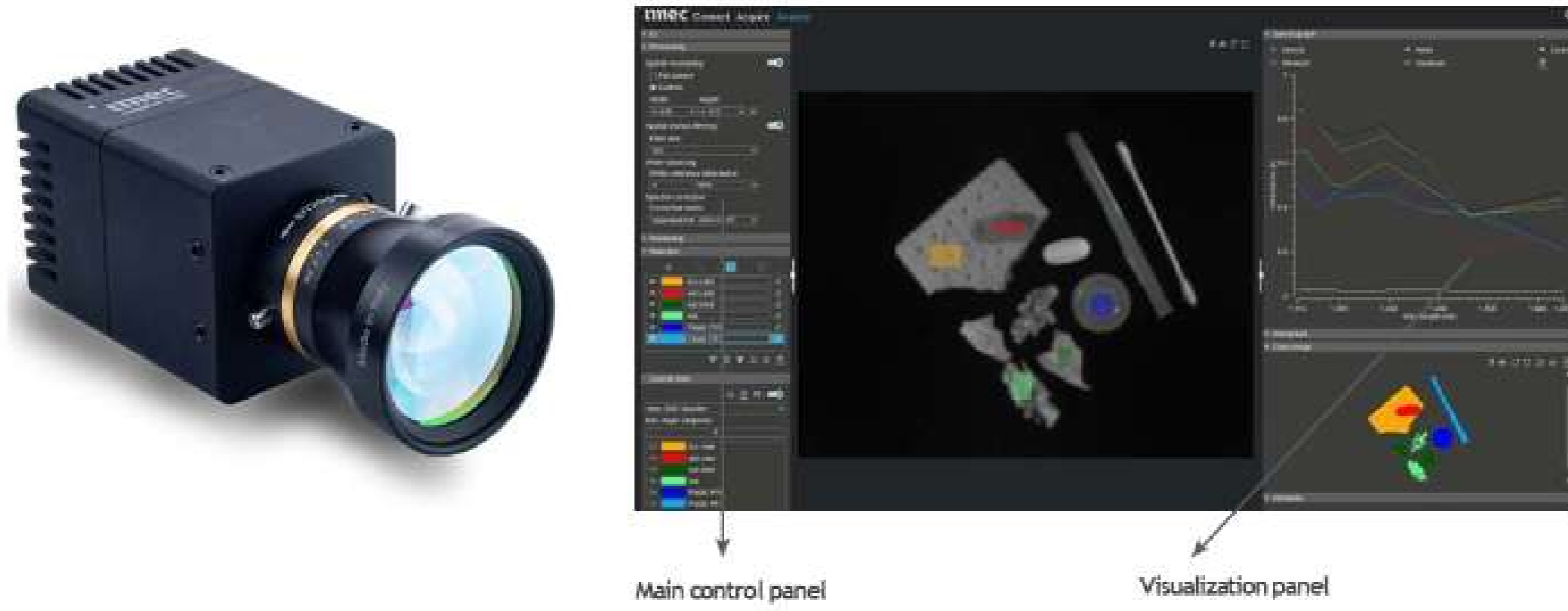


8大回收塑膠辨識 - Snapshot SWIR

在人眼可見光範圍非常難以辨認，但在短波紅外波段(Short-wave infrared)不同的塑膠材料有不同的光譜特徵，透過短波紅外波段的高光譜影像分析即可完成辨識。

規格		
光譜範圍	1100-1650 nm (SWIR)	位元深度 13 bits
波段數	8	鏡頭 18 / 25 / 35 / 50 mm lenses C-mount
空間解析度	640 x 512	相機介面 USB3.0 + GPIO (選件)
圖格率	最大 130 張/秒	重量 280g (不含鏡頭)

Imec 快照 SWIR 系列高光譜相機優點以視訊速率擷取高光譜成像資料立方體，無運動殘影，非常適合擷取移動中樣品材料的擷取和分析。



了解更多

Technical Sales 王懿翔
E-mail: mingyi@isuzuoptics.com.tw
電話: +886-3-552-6689 #21
週一 - 週五: 9:00-12:00 / 13:00-18:00